

平成 26 年度 化学研究所若手研究者国際短期派遣事業滞在報告書

ナノスピントロニクス分科 永田真己

化学研究所若手研究者国際派遣事業により、10月1日から、10月31日までの間、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)に滞在いたしました。NISTは、計測技術標準研究所として100年以上前に設立され、現在は一万人程度の国内外の研究者が、計量学だけにとどまらず、物性計測技術の分野においても研究を行っています。

滞在先としてアメリカ合衆国のNISTを選んだ理由は二つありました。一つは、NISTにおいて行われている光学的手法を用いた磁気特性の評価のプロジェクトに関わりたいと思ったことです。もう一つは、アメリカ合衆国という、科学的に、また経済的に非常に発達している国が、どのようなやり方でプロジェクトを進めるのか自らの経験を通して感じ取ってみたいかったためです。

私は、一ヶ月の間、NISTのポスドクの方に教えていただきながら、新しい磁気特性評価プローブの作製のプロジェクトに参加いたしました。その過程で、光学的手法を用いた物性評価が、電気的特性の評価に比べ、非常に視認性に優れており、物性をより直接的に観測できる手法だと感じました。実験技術を日々驚きとともに学ぶことができ、大変充実した時間でした。

また、実験を手伝わせていただいたポスドクの方をはじめとして、多くの研究者は、プロジェクトの方針の転換や、結果から計画へのフィードバックが非常に速いと感じました。共に研究を行ううちに、日本での自分の研究スタイルがどのようなものだったのかをより客観的に感じ取ることができたように思います。このことは自分にとって、大変に内省を促す経験でした。

アメリカ合衆国は、様々な人種の方がすんでいます。飛び交う言語は英語がほとんどであるのに、人々は違った風に英語を話します。そうした違いを超え、人々は協調し合っています。おそらく、「人と違う」ということを尊重する雰囲気があるのだと思います。そうした輪の中に多少なりとも自分が属しているということ、大変心地よく感じていたように思います。このような貴重な機会をいただき、先生方、事務部の皆様に感謝いたします。



NISTの正門にて、撮っていただきました。